

PH1200A280

RELIABILITY DATA

信頼性データ

INDEX

	PAGE
1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF	3
2. 部品ディレーティング Components Derating	4
3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise ΔT List	6
4. アブノーマル試験 Abnormal Test	8
5. 振動試験 Vibration Test	13
6. 衝撃試験 Shock Test	15
7. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test	17
8. はんだ耐熱性試験 Resistance to Soldering Heat Test	19
9. 热衝撃試験 Thermal Shock Test	20
10. 高温加湿通電試験 High Temperature and High Humidity Bias Test	23
11. 高温連続通電試験 High Temperature Bias Test	25

※ 信頼性試験は、代表データであり、全ての製品は、ほぼ同等な特性を示します。
従いまして、この値は実力値とお考え願います。

The following data are typical values. As all units have nearly the same characteristics,
the data to be considered as ability values.

1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF

MODEL : PH1200A280-48

(1) 算出方法 Calculating Method

Telcordiaの部品ストレス解析法(*1)で算出されています。

故障率 λ_{ss} は、それぞれの部品ごとに電気ストレスと動作温度によって計算されます。

Calculated based on parts stress reliability projection of Telcordia (*1).

Individual failure rate λ_{ss} is calculated by the electric stress and temperature rise of the each device.

*1: Telcordia document “Reliability Prediction Procedure for Electronic Equipment”
(Document number SR-332, Issue3)

$$<\text{算出式}> \quad MTBF = \frac{1}{\lambda_{equip}} = \frac{1}{\pi_E \sum_{i=1}^m N_i \cdot \lambda_{ssi}} \times 10^9 \text{ 時間 (hours)}$$

$$\lambda_{ssi} = \lambda_{Gi} \cdot \pi_{Qi} \cdot \pi_{Si} \cdot \pi_{Ti}$$

λ_{equip} : 全機器故障率(FITs) Total Equipment failure rate (FITs = Failures in 10^9 hours)

λ_{Gi} : i 番目の部品に対する基礎故障率 Generic failure rate for the i th device

π_{Qi} : i 番目の部品に対する品質ファクタ Quality factor for the i th device

π_{Si} : i 番目の部品に対するストレスファクタ Stress factor for the i th device

π_{Ti} : i 番目の部品に対する温度ファクタ Temperature factor for the i th device

m : 異なる部品の数 Number of different device types

N_i : i 番目の部品の個数 Quantity of i th device type

π_E : 機器の環境ファクタ Equipment environmental factor

(2) MTBF値 MTBF Values

・入力電圧 : 280VDC • 出力電流 : 25A (100%), 20A (80%)

Input Voltage

Output Current

・環境ファクタ

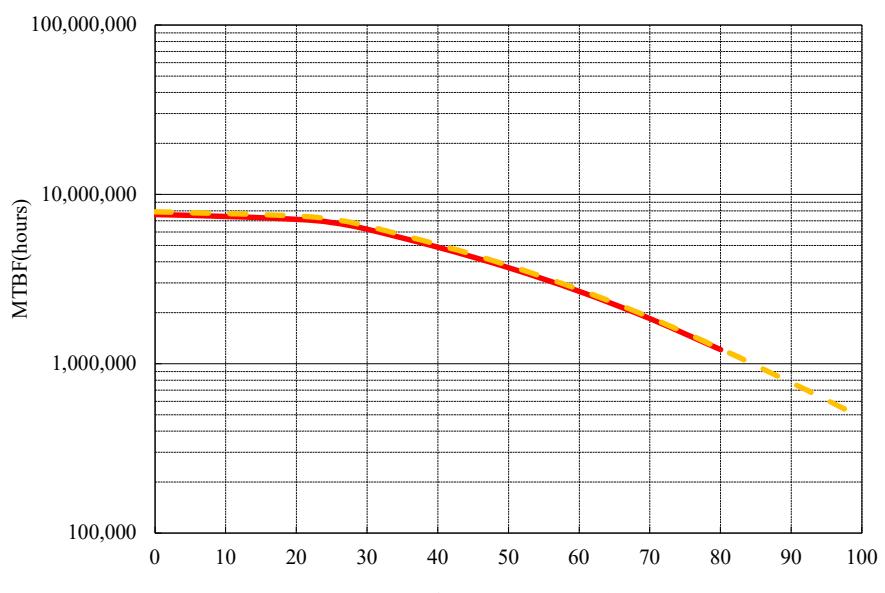
: GF (Ground fixed)

Environment

Io=100%

Baseplate temperature	MTBF
25°C	6,834,995 (hours)
40°C	4,870,826 (hours)
80°C	1,211,470 (hours)

MTBF vs. Baseplate temperature



Io=80%

Baseplate temperature	MTBF
25°C	7,143,266 (hours)
40°C	5,055,927 (hours)
80°C	1,226,759 (hours)
100°C	480,750 (hours)

— PH1200A280-48 Output Current: 25A (100%)
- - - PH1200A280-48 Output Current: 20A (80%)

2. 部品ディレーティング Components Derating

MODEL : PH1200A280-12, PH1200A280-48

(1) 算出方法 Calculating Method

(a) 測定条件 Measuring Conditions

・入力電圧 Input Voltage	: 280VDC
・出力電流 Output Current	: 100% (12V), 80% (48V) *due to output derating
・取付方法 Mounting Method	: 標準取付(放熱器有) Standard Mounting Method (with Heatsink)
・ベースプレート温度 Baseplate Temperature	: 100°C

(b) 半導体 Semiconductors

ケース温度、消費電力および熱抵抗より使用状態の接合点温度を求め、最大定格との比較を行いました。

The maximum rating temperature is compared with junction temperature which is calculated based on case temperature, power dissipation and thermal impedance.

(c) IC、抵抗、コンデンサー等 IC, Resistors, Capacitors, etc.

周囲温度、使用状態、消費電力など、個々の値は設計基準内に入っています。

Ambient temperature, operating condition, power dissipation, etc are within derating criteria.

(d) 热抵抗算出方法 Calculating Method of Thermal Impedance

$$\theta_{j-c} = \frac{T_{j(max)} - T_c}{P_{c(max)}} \quad \theta_{j-a} = \frac{T_{j(max)} - T_a}{P_{c(max)}} \quad \theta_{j-l} = \frac{T_{j(max)} - T_l}{P_{c(max)}}$$

T_c : ディレーティングの始まるケース温度 一般に25°C
Case Temperature at Start Point of Derating; 25°C in General

T_a : ディレーティングの始まる周囲温度 一般に25°C
Ambient Temperature at Start Point of Derating; 25°C in General

T_l : ディレーティングの始まるリード温度 一般に25°C
Lead Temperature at Start Point of Derating; 25°C in General

P_{c(max)} : 最大コレクタ(チャネル)損失
(P_{ch(max)}) Maximum Collector(Channel) Dissipation

T_{j(max)} : 最大接合点温度
(T_{ch(max)}) Maximum Junction(Channel) Temperature

θ_{j-c} : 接合点からケースまでの熱抵抗
(θ_{ch-c}) Thermal Impedance between Junction(Channel) and Case

θ_{j-a} : 接合点から周囲までの熱抵抗
(θ_{ch-a}) Thermal Impedance between Junction(Channel) and Air

θ_{j-l} : 接合点からリードまでの熱抵抗
(θ_{ch-l}) Thermal Impedance between Junction(Channel) and Lead

(2) 部品ディレーティング表 Components Derating List

(2)-1 PH1200A280-12

部品番号 Location No.	部品名 Part Name	最大定格 MAX Rating	使用状態 Actual Rating	ディレーティング率 Derating Rate
Q301	CHIP MOS FET	Tch(max): 150.0°C	Tch: 116.1°C	77.4%
Q302	CHIP MOS FET	Tch(max): 150.0°C	Tch: 109.1°C	72.7%
Q303	CHIP MOS FET	Tch(max): 150.0°C	Tch: 116.1°C	77.4%
Q304	CHIP MOS FET	Tch(max): 150.0°C	Tch: 114.3°C	76.2%
D302	CHIP DIODE	Tj(max): 150.0°C	Tj: 105.4°C	70.3%
Q153	CHIP MOS FET	Tch(max): 150.0°C	Tch: 111.3°C	74.2%
Q158	CHIP MOS FET	Tch(max): 150.0°C	Tch: 109.1°C	72.7%
PC1	CHIP COUPLER	Tj(max): 125.0°C	Tj: 100.5°C	80.4%
PC2	CHIP COUPLER	Tj(max): 125.0°C	Tj: 102.6°C	82.1%
A301	CHIP IC	Tj(max): 150.0°C	Tj: 130.4°C	86.9%
A2	CHIP IC	Tj(max): 150.0°C	Tj: 120.0°C	80.0%
A5	CHIP IC	Tj(max): 150.0°C	Tj: 118.5°C	79.0%
A204	CHIP IC	Tj(max): 125.0°C	Tj: 111.0°C	88.8%
A205	CHIP IC	Tj(max): 125.0°C	Tj: 105.7°C	84.6%

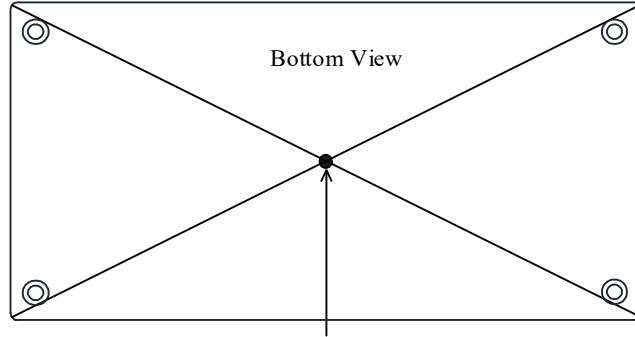
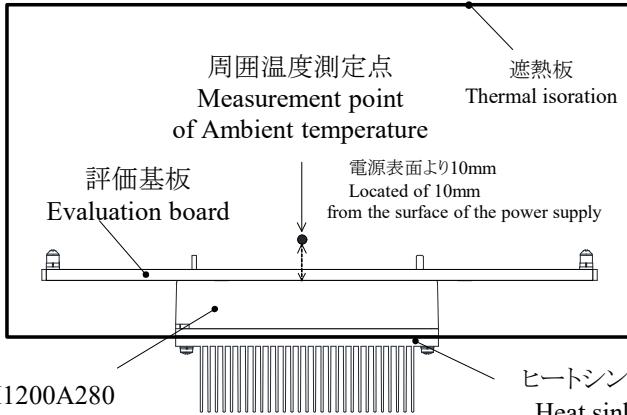
(2)-2 PH1200A280-48

部品番号 Location No.	部品名 Part Name	最大定格 MAX Rating	使用状態 Actual Rating	ディレーティング率 Derating Rate
Q301	CHIP MOS FET	Tch(max): 150.0°C	Tch: 116.6°C	77.7%
Q302	CHIP MOS FET	Tch(max): 150.0°C	Tch: 114.3°C	76.2%
Q303	CHIP MOS FET	Tch(max): 150.0°C	Tch: 121.5°C	81.0%
Q304	CHIP MOS FET	Tch(max): 150.0°C	Tch: 110.2°C	73.5%
D302	CHIP DIODE	Tj(max): 150.0°C	Tj: 105.3°C	70.2%
Q151	CHIP MOS FET	Tch(max): 150.0°C	Tch: 113.0°C	75.3%
Q153	CHIP MOS FET	Tch(max): 150.0°C	Tch: 102.9°C	68.6%
Q156	CHIP MOS FET	Tch(max): 150.0°C	Tch: 104.1°C	69.4%
Q159	CHIP MOS FET	Tch(max): 150.0°C	Tch: 104.4°C	69.6%
PC1	CHIP COUPLER	Tj(max): 125.0°C	Tj: 100.5°C	80.4%
PC2	CHIP COUPLER	Tj(max): 125.0°C	Tj: 102.6°C	82.1%
A301	CHIP IC	Tj(max): 150.0°C	Tj: 130.4°C	86.9%
A2	CHIP IC	Tj(max): 150.0°C	Tj: 120.0°C	80.0%
A5	CHIP IC	Tj(max): 150.0°C	Tj: 118.5°C	79.0%
A204	CHIP IC	Tj(max): 125.0°C	Tj: 111.0°C	88.8%
A205	CHIP IC	Tj(max): 125.0°C	Tj: 105.7°C	84.6%

3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise ΔT List

MODEL : PH1200A280-12, PH1200A280-48

(1) 測定条件 Measuring Conditions

測定方法 Measurement Method	ベースプレート温度測定方法 Baseplate Temperature Measurement Method			
	 <p>ベースプレート温度測定点 Measurement Point of Baseplate Temperature</p>			
周囲温度測定方法 Ambient Temperature Measurement Method				
 <p>周囲温度測定点 Measurement point of Ambient temperature</p> <p>評価基板 Evaluation board</p> <p>電源表面より10mm Located of 10mm from the surface of the power supply</p> <p>遮熱板 Thermal isorlation</p> <p>ヒートシンク Heat sink</p> <p>PH1200A280</p>				
入力電圧 Input Voltage	280VDC			
出力電圧 Output Voltage	12VDC	48VDC		
出力電流 Output Current	100A (100%)	20A (Derating to 80% load)		
ベースプレート温度 Baseplate Temperature	100°C			
周囲温度 Ambient Temperature	85°C			

ΔT_{C-P} : 周囲温度85°Cにおいてベースプレート温度が100°Cとなる放熱条件とし、その時のベースプレート温度を基準とした各部品の ΔT (ベースプレートと部品との温度差)を表したもの。

Temperature difference between a case of each component and baseplate, fitted power supply with heatsink to be maintained 100°C (baseplate temperature) at 85°C(ambient temperature).

(2) 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise ΔT List

(2)-1 PH1200A280-12

部品番号 Location No.	部品名 Part Name	温度上昇値 ΔT_{C-P} Temperature Rise (°C)
Q301	CHIP MOS FET	10.3
Q302	CHIP MOS FET	3.3
Q303	CHIP MOS FET	9.1
Q304	CHIP MOS FET	7.3
D301	CHIP DIODE	4.3
D302	CHIP DIODE	3.5
Q153	CHIP MOS FET	9.3
Q158	CHIP MOS FET	7.1
PC2	CHIP COUPLER	4.1
A2	CHIP IC	6.7
A4	CHIP IC	5.4
A201	CHIP IC	14.2
A204	CHIP IC	4.0
A205	CHIP IC	4.4
T302	TRANS,PULSE	37.2
T303	TRANS,PULSE	4.3
L151	CHOKE COIL	6.4

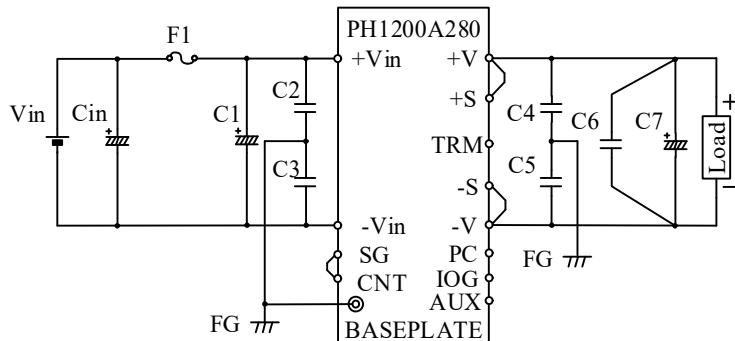
(2)-2 PH1200A280-48

部品番号 Location No.	部品名 Part Name	温度上昇値 ΔT_{C-P} Temperature Rise (°C)
Q301	CHIP MOS FET	10.8
Q302	CHIP MOS FET	13.5
Q303	CHIP MOS FET	14.5
Q304	CHIP MOS FET	5.5
D301	CHIP DIODE	3.7
D302	CHIP DIODE	2.7
Q152	CHIP MOS FET	11.9
Q155	CHIP MOS FET	0.2
Q158	CHIP MOS FET	2.3
Q161	CHIP MOS FET	0.3
PC2	CHIP COUPLER	0.5
A2	CHIP IC	8.9
A4	CHIP IC	9.9
A201	CHIP IC	15.1
A204	CHIP IC	2.2
A205	CHIP IC	-0.4
T302	TRANS,PULSE	40.5
T303	TRANS,PULSE	4.6
L151	CHOKE COIL	21.3

4. アブノーマル試験 Abnormal Test

MODEL : PH1200A280-48

(1) 試験条件及び回路 Test Condition and Circuit



・入力電圧 Input Voltage	: 425VDC	・出力電流 Output Current	: 25A (100%)
・ベースプレート温度 Baseplate Temperature	: 25°C	・電解コンデンサ (C1) Electrolytic Cap.	: 450V 10,000μF
・電解コンデンサ (C1) Electrolytic Cap.	: 450V 22μF	・セラミックコンデンサ (C2,C3) Ceramic Cap.	: 250VAC 4,700pF
・フィルムコンデンサ (C4,C5) Film Cap.	: 630V 0.022μF	・セラミックコンデンサ (C6) Ceramic Cap.	: 100V 2.2μF
・ヒューズ (F1) Fuse	: 500VDC, 10A (WN30-10)	・電解コンデンサ (C7) Electrolytic Cap.	: 50V 1,500μF×2 Series

(2) 試験結果 (Test Results)

(2)-1 PH1200A280-48

No.	試験箇所 Test Point	試験 モード Test Mode	試験結果 Test Results												備考 Note	
			Fi:Fire Da:Damaged		So:Smoke Fu:Fuse Blown		Bu:Burst NO:No Output		Se:Smell NC:No Change		Re:Red Hot Ot:Others					
部品 Location No.	試験 端子 Test Terminal	S	O	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	備考 Note
		H	P	発 火	発 煙	破 裂	異 臭	発 熱	破 損	ヒ ュ ー ズ 断 Fu	O V P	O C P	出 力 断 NO	変 化 な し NC	そ の 他 Ot	
1	Q301	D-S		●						●	●					Da: Q301,Q302,Q305,Q1
2		D-G		●						●	●					Da: Q302
3		G-S		●												
4		D		●						●	●					Da: Q301,Q302
5		G		●												
6		S		●												
7	Q302	D-S		●						●	●					Da: Q301,Q302,Q306,Q2
8		D-G		●						●	●					Da: Q301
9		G-S		●												
10		D		●						●	●					Da: Q301,Q302
11		G		●												
12		S		●												
13	Q303	D-S		●						●	●					Da: Q303,Q304,Q307,Q3
14		D-G		●						●	●					Da: Q304
15		G-S		●												
16		D		●						●	●					Da: Q303,Q304
17		G		●												
18		S		●												

No.	試験箇所 Test Point	試験モード Test Mode	試験結果 Test Results														
			Fi:Fire Da:Damaged		So:Smoke Fu:Fuse Blown		Bu:Burst NO:No Output		Se:Smell NC:No Change		Re:Red Hot Ot:Others						
部品 Location No.	試験 端子 Test Terminal	S	O	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	備考 Note	
		H	P	発 火	発 煙	破 裂	異 臭	発 熱	破 損	ヒ ュ ー ズ 断 Fu	O V P	O C P	出 力 断 NO	変 化 な し NC	そ の 他 Ot		
19	Q304	D-S	●						●	●			●			Da: Q303,Q304,Q308,Q4	
20		D-G	●						●	●			●			Da: Q303	
21	Q304	G-S	●										●				
22		D		●					●	●			●			Da: Q303,Q304	
23		G		●									●				
24		S		●									●				
25	D301	A-C	●						●	●			●			Da: Q301,Q302	
26		A,C		●										●		Eff. drop, Q151-Q162 over stress	
27	D302	A-C	●						●	●			●			Da: Q301,Q302	
28		A,C		●										●		Eff. drop, Q151-Q162 over stress	
29	Q153 (Q154 Q155)	D-S	●							●			●			Da: Q156,Q153,A201	
30		D-G	●										●				
31		G-S	●											●		Eff. drop	
32		D		●					●				●			Da: Q156,Q153	
33		G		●									●				
34		S		●									●				
35	Q156 (Q157 Q158)	D-S	●							●			●			Da:Q156,Q153,A201	
36		D-G	●										●				
37		G-S	●											●		Eff. drop	
38		D		●					●				●			Da: Q156,Q153	
39		G		●									●				
40		S		●									●				
41	Q159 (Q160 Q161)	D-S	●							●			●			Da: Q159,Q162,A202	
42		D-G	●										●				
43		G-S	●											●		Eff. drop	
44		D		●					●				●			Da: Q159,Q162	
45		G		●									●				
46		S		●									●				
47	Q162 (Q151 Q152)	D-S	●						●				●			Da: Q159,Q162,A202	
48		D-G	●										●				
49		G-S	●											●		Eff. drop	
50		D		●					●				●			Da: Q159,Q162	
51		G		●									●				
52		S		●									●				
53	PC2	1		●							●		●				
54		2		●						●			●				
55		3		●						●			●				
56		4		●						●			●				
57		1-2		●						●			●				
58		3-4		●						●			●				
59	A2	1		●						●			●				
60		2		●						●			●				
61		3		●						●			●				
62		4		●						●			●				
63		5		●									●				
64		6		●									●				
65		7		●									●				
66		8		●					●				●			Da: Q156,Q153(Q162,Q159)	
67		9		●					●				●			Da: Q301,Q302(Q303,Q304)	

No.	試験箇所 Test Point	試験 モード Test Mode	試験結果 Test Results													
			Fi:Fire Da:Damaged		So:Smoke Fu:Fuse Blown		Bu:Burst NO:No Output		Se:Smell NC:No Change		Re:Red Hot Ot:Others					
部品 Location No.	試験 端子 Test Terminal	S	O	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	備考 Note
		H	P	発 火	発 煙	破 裂	異 臭	発 熱	破 損	ヒ ュ ー ズ 断 Fu	O V P	O C P	出 力 断 NO	変 化 な し NC	そ の 他 Ot	
68				●									●			
69				●									●			
70				●									●		Eff. drop	
71				●									●		Eff. drop	
72				●									●		Eff. drop	
73				●								●				
74				●									●			
75				●					●			●			Da: Q162,Q159,Q153,Q156	
76				●					●			●			Da: Q162,Q159,Q153,Q156	
77				●					●	●		●			Da: Q303,Q304	
78				●					●	●		●			Da: Q303,Q304	
79				●					●	●		●			Da: Q303,Q304	
80				●					●	●		●			Da: Q303,Q304	
81				●								●				
82				●								●				
83			1-2	●							●					
84			2-3	●							●					
85			3-4	●						●						
86			4-5	●							●					
87			5-6	●							●					
88			6-7	●							●				No OUTD ,Q301,Q302 gate is low	
89			7-8	●							●				No OUTD ,Q301,Q302 gate is low	
90			8-9	●							●				No OUTD ,Q301,Q302 gate is low	
91			9-10	●							●					
92			10-11	●							●				Same as pin9,pin10 short	
93			11-12	●							●				Unit enter hiccup state	
94			13-14	●								●			Eff. drop	
95			14-15	●								●			Eff. drop	
96			15-16	●								●				
97			16-17	●					●			●			Da: A2 (VDD short)	
98			17-18	●					●			●			Da: Q156,Q153(Q162,Q159)	
99			18-19	●					●	●		●			Da: Q301,Q302(Q156,Q153)	
100			19-20	●					●	●		●			Da: Q301,Q302	
101			20-21	●					●	●		●			Da: Q301,Q302,Q303,Q304	
102			21-22	●					●	●		●			Da: Q303,Q304	
103			22-23	●					●	●		●			Da: Q303,Q304	
104			23-24	●							●				Vcc of A2 hiccup	
105	A4(A5)		1	●								●				
106			2	●						●	●		●		Da: Q301,Q302	
107			3	●								●				
108			4	●					●	●		●			Da: Q303,Q304	
109			5	●								●				
110			6	●							●					
111			7	●							●					
112			8	●								●				
113			1-2	●								●				
114			2-3	●						●		●			Da: A2	
115			3-4	●						●		●			Da: A2	
116			5-6	●						●	●	●			Da: A4(A5),Q303,Q304(Q301,Q302)	

No.	試験箇所 Test Point	試験 モード Test Mode	試験結果 Test Results													
			Fi:Fire Da:Damaged		So:Smoke Fu:Fuse Blown		Bu:Burst NO:No Output		Se:Smell NC:No Change		Re:Red Hot Ot:Others					
部品 Location No.	試験 端子 Test Terminal	S	O	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	備考 Note
		H	P	発 火	発 煙	破 裂	異 臭	発 熱	破 損	ヒ ュ ー ズ 断 Fu	O V P	O C P	出 力 断 NO	変 化 な し NC	そ の 他 Ot	
117	A4(A5)	6-7	●						●	●			●			Da: A4(A5),Q303,Q304(Q301,Q302)
118		7-8	●										●			
119	A201 (A202)	1	●											●		Eff. drop
120		2	●											●		Eff. drop
121		3	●											●		Eff. drop
122		4	●											●		Eff. drop
123		5	●											●		Eff. drop
124		6	●											●		Eff. drop
125		7	●											●		Eff. drop
126		8	●											●		Eff. drop
127		1-2	●						●				●			Da : Q156(Q162),Q153(Q159)
128		2-3	●											●		Eff. drop
129		3-4	●						●					●		Eff. drop, Da: A201(A202)
130		5-6	●						●					●		Eff. drop, Da: A201(A202)
131		6-7	●											●		Eff. drop, Da: A201(A203)
132		7-8	●						●				●			Da: A201(A202),Q156(Q162),Q153(Q159)
133	L301	1	●										●			
134		2	●										●			
135		1-2	●										●			
136	L302	1	●										●			
137		2	●										●			
138		1-2	●											●		Eff. has big drop
139	L151	1	●										●			
140		2	●										●			
141		1-2	●										●			
142	L152	1	●						●				●			
143		2	●						●				●			
144		1-2	●										●			
145	T301	pin2	●						●				●			Da: Q301,Q304(Q303,Q302)
146		pin3	●						●				●			Da: Q301,Q304(Q303,Q302)
147		pin7	●										●			
148		pin8	●										●			
149		pin2-pin3	●						●				●			Da: Q301,Q304(Q303,Q302)
150		pin7-pin8	●						●				●			Da: Q301,Q304(Q303,Q302)
151	T302	1	●										●			
152		2	●											●		Q151-Q162 stress increase
153		3	●										●			
154		4	●										●			
155		5	●										●			
156		6	●										●			
157		1-2	●						●				●			Da: Q156,Q153,Q159,Q162
158		2-3	●											●		Eff. drop
159		4-6	●										●			
160		5-6	●										●			
161	T303	1	●										●			
162		2	●										●			
163		4	●										●			
164		6	●										●			
165		8	●										●			

No.	試験箇所 Test Point	試験 モード Test Mode	試験結果 Test Results													
			Fi:Fire Da:Damaged		So:Smoke Fu:Fuse Blown		Bu:Burst NO:No Output		Se:Smell NC:No Change		Re:Red Hot Ot:Others					
部品 Location No.	試験 端子 Test Terminal	S	O	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	備考 Note
		H	P	発 火	発 煙	破 裂	異 臭	発 熱	破 損	ヒ ュ ー ズ 断 Fu	O V P	O C P	出 力 断 NO	変 化 な し NC	そ の 他 Ot	
166	T303	9		●						●		●				
167		10		●										●	Eff. drop	
168		11		●										●	Eff. drop	
169		1-2	●						●			●				Da: A301
170		2-4	●					●			●		●			Da: A301
171		4-6	●								●					
172		8-9	●								●					
173		10-11	●								●					
174	T1 (T2)	1		●							●					
175		2		●							●					
176		3		●							●					
177		4		●							●					
178		5		●							●					
179		6		●							●					
180		1-2	●					●			●					Da: R11,R12 (R21,R22)
181		3-4	●					●			●					Da: R11,R12 (R21,R22)
182		5-6	●					●			●					Da: R11,R12 (R21,R22)

5. 振動試験 Vibration Test

MODEL : PH1200A280-12, PH1200A280-28

(1) 振動試験種類 Vibration Test Class

掃引振動数耐久試験 Frequency Variable Endurance Test

(2) 使用振動試験装置 Equipment Used

東菱科技 DONGLING TECH	試験装置 Test Equipment	ES-30-370
-----------------------	------------------------	-----------

(3) 供試品台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

PH1200A280-12	: 3台 (3 units)
PH1200A280-28	: 3台 (3 units)

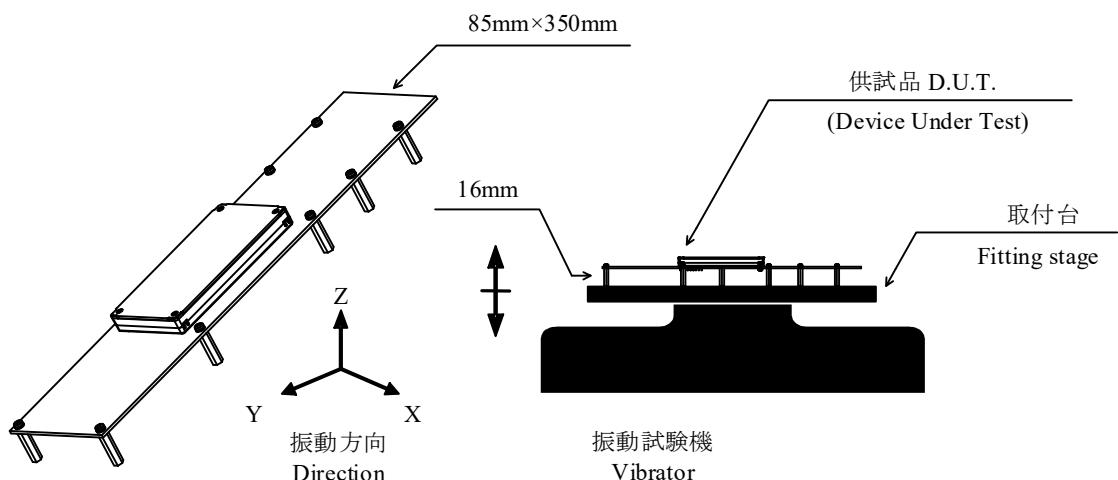
(4) 試験条件 Test Conditions

- ・周波数範囲 : 10~55Hz
Sweep Frequency
- ・掃引時間 : 1 分間
Sweep Time 1 min.
- ・振幅 : 0.825mm (一定)
Amplitude 0.825mm (constant)
- ・振幅方向 : X, Y, Z
Directions
- ・試験時間 : 各方向1 時間
Test Time 1 hour each

(5) 試験方法 Test Method

供試品を基板に取付け(M3ビスで4箇所固定)、それを取付台に固定する。

Fix the D.U.T. on the circuit board (fitting by four M3-tapped-holes) and fit it on the fitting-stage.



(5) 試験結果 Test Results

合格 OK

・試験条件 Test Conditions

入力電圧: 280VDC 出力電流: 100A(12V), 42.9A(28V)

Input Voltage Output Current

ベースプレート温度: 25°C

Baseplate Temperature

供試モデル: PH1200A280-12

DUT

測定確認項目 Check Item		No.1		No.2		No.3	
		試験前 Before Test	試験後 After Test	試験前 Before Test	試験後 After Test	試験前 Before Test	試験後 After Test
出力電圧 Output Voltage	V	12.020	12.019	12.011	12.009	12.026	12.022
リップル電圧 Ripple Voltage	mVp-p	64	52	52	70	52	62
入力変動 Line Regulation	mV	0.297	0.396	0.280	0.311	0.454	0.314
負荷変動 Load Regulation	mV	0.411	0.016	0.014	0.064	0.177	0.120
外観 Appearance	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK

供試モデル: PH1200A280-28

DUT

測定確認項目 Check Item		No.1		No.2		No.3	
		試験前 Before Test	試験後 After Test	試験前 Before Test	試験後 After Test	試験前 Before Test	試験後 After Test
出力電圧 Output Voltage	V	28.112	28.106	28.047	28.048	28.059	28.052
リップル電圧 Ripple Voltage	mVp-p	102	108	99	104	99	106
入力変動 Line Regulation	mV	0.657	0.918	0.272	0.493	0.060	0.163
負荷変動 Load Regulation	mV	0.559	0.620	0.640	0.424	0.471	0.316
外観 Appearance	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK

6. 衝撃試験 Shock Test

MODEL : PH1200A280-12, PH1200A280-28

(1) 使用衝撃試験装置 Equipment Used

東菱科技 DONGLING TECH	試験装置 Test Equipment	ES-30-370
-----------------------	------------------------	-----------

(2) 供試品台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

PH1200A280-12	: 3 台 (3 units)
PH1200A280-28	: 3 台 (3 units)

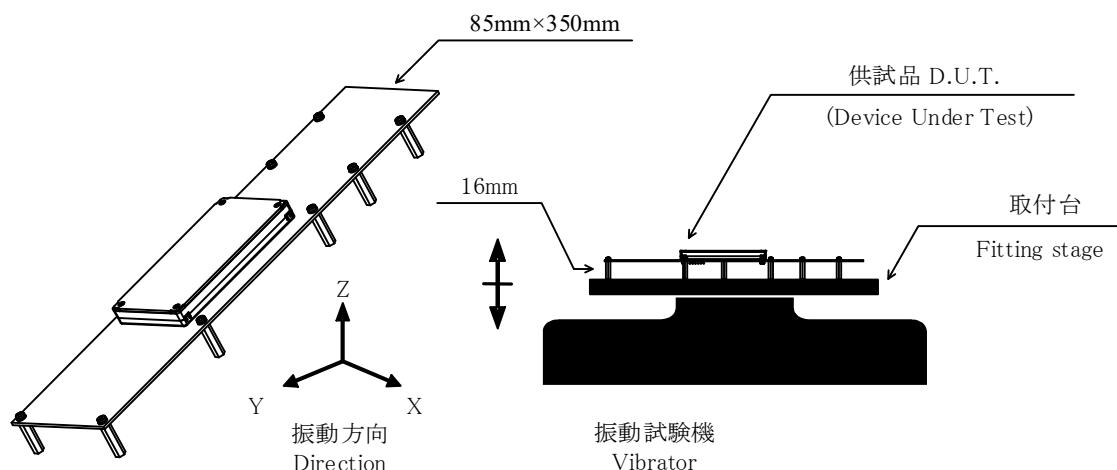
(3) 試験条件 Test Conditions

・パルス波形 Pulse Waveform	: 正弦半波 Half Sine Waveform	・加速度 Acceleration	: 196.1m/s^2
・衝撃方向 Direction	: X, Y, Z	・試験時間 Test Time	: $11\text{ms}\pm 5\text{ms}$
・衝撃回数 Number of Times	: +、- 方向に各3回 3 times each for +, - direction		

(4) 試験方法 Test Method

供試品を基板に取付け(M3ビスで4箇所固定)、それを取付台に固定する。

Fix the D.U.T. on the circuit board (fitting by four M3-tapped-holes) and fit it on the fitting-stage.



(5) 試験結果 Test Results

合格 OK

・試験条件 Test Conditions

入力電圧:280VDC 出力電流: 100A(12V), 42.9A(28V)

Input Voltage Output Current

ベースプレート温度:25°C

Baseplate Temperature

供試モデル:PH1200A280-12

DUT

測定確認項目 Check Item		No.1		No.2		No.3	
		試験前 Before Test	試験後 After Test	試験前 Before Test	試験後 After Test	試験前 Before Test	試験後 After Test
出力電圧 Output Voltage	V	12.053	12.049	12.004	12.075	12.044	12.039
リップル電圧 Ripple Voltage	mVp-p	55	58	62	65	59	64
入力変動 Line Regulation	mV	0.323	0.378	0.271	0.338	0.745	0.618
負荷変動 Load Regulation	mV	0.384	0.412	0.269	0.304	0.297	0.274
外観 Appearance	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK

供試モデル:PH1200A280-28

DUT

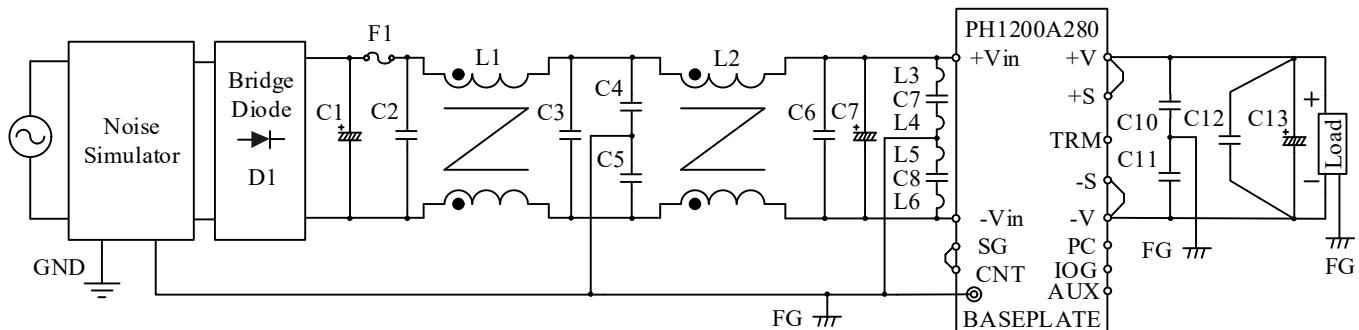
測定確認項目 Check Item		No.1		No.2		No.3	
		試験前 Before Test	試験後 After Test	試験前 Before Test	試験後 After Test	試験前 Before Test	試験後 After Test
出力電圧 Output Voltage	V	28.023	28.029	28.088	28.075	28.074	28.057
リップル電圧 Ripple Voltage	mVp-p	115	122	105	102	107	115
入力変動 Line Regulation	mV	0.894	0.842	0.562	0.675	0.741	0.852
負荷変動 Load Regulation	mV	0.641	0.695	0.589	0.476	0.525	0.691
外観 Appearance	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK

7. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test

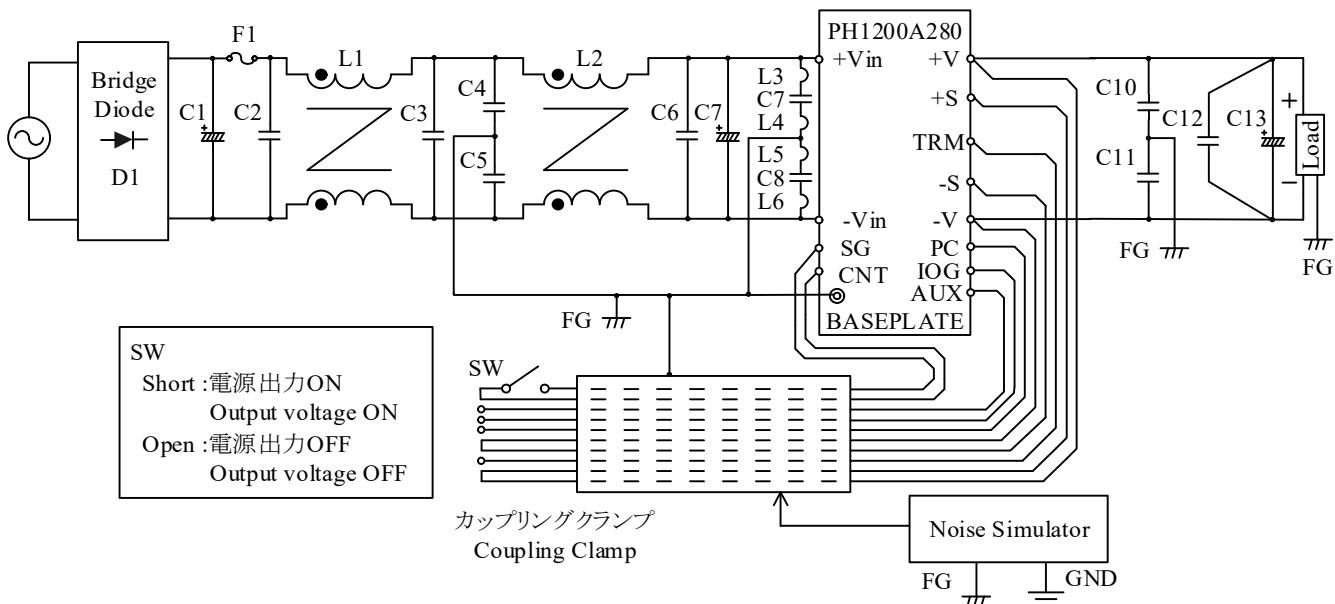
MODEL : PH1200A280 (All output models)

(1) 試験回路及び測定器 Test Circuit and Equipment

- A. 入力ポート : [L, N], [L, FG], [N, FG]に印加
Input port Apply to [L, N], [L, FG] and [N, FG].



- B. 信号ポート : SG, CNT, +S, -S, IOG, PC, TRM, AUXに同時に印加
Signal Port Apply to SG, CNT, +S, -S, IOG, PC, TRM and AUX at the same time.



- ブリッジダイオード (D1) : D25XB60(Shindengen)
- Bridge Diode
- ヒューズ (F1) : 500VDC, 10A (WN30-10)
- Fuse
- 電解コンデンサ (C1) : 450V 560μF × 6 Parallel
- Electrolytic Cap.
- チョークコイル (L1) : 5.0mH
- Choke coil
- チョークコイル (L2) : 3.8mH
- Choke coil
- フィルムコンデンサ (C2,C3,C6) : 250VAC 0.68μF
- Film Cap.
- チョークコイル (L3,L4,L5,L6) : 3.3μH (HF57BB3.35X2X2)
- Bead Core
- セラミックコンデンサ (C4,C5,C8,C9) : 250VAC 2200pF
- Ceramic Cap.
- 電解コンデンサ (C7) : 450V 22μF
- Electrolytic Cap.

・フィルムコンデンサ (C10,C11)	: 630V 0.022μF
Film Cap.	
・セラミックコンデンサ (C12)	: 100V 2.2μF
Ceramic Cap.	
・電解コンデンサ (C13)	12V : 25V 1,500μF × 2 Parallel
Electrolytic Cap.	24V : 50V 1,500μF
	28V : 50V 1,500μF
	36V : 63V 560μF × 2 Parallel
	48V : 50V 1,500μF × 2 Series

(2) 供試品台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

PH1200A280-12	: 1 台 (1 unit)
PH1200A280-24	: 1 台 (1 unit)
PH1200A280-28	: 1 台 (1 unit)
PH1200A280-36	: 1 台 (1 unit)
PH1200A280-48	: 1 台 (1 unit)

(3) 試験条件 Test Conditions

・入力電圧 Input Voltage	: 280VDC	・ノイズ電圧 Noise Level	: 入力ポート 0 ~ 2kV Input Port
・出力電圧 Output Voltage	: 定格 Rated		信号ポート 0 ~ 750V Signal Port
・出力電流 Output Current	12V : 0A (0%), 100A (100%) 24V : 0A (0%), 50A (100%) 28V : 0A (0%), 42.9A (100%) 36V : 0A (0%), 33.4A (100%) 48V : 0A (0%), 25A (100%)		
・位相 Phase shift	: 0° ~ 360°		
・ベースプレート温度 Baseplate Temperature	: 25°C	・極性 Polarity	: +, -
・パルス幅 Pulse Width	: 50 ~ 1000ns	・印加モード Mode	: 入力ポート ノーマル、コモン Input Port Normal, Common
・トリガ選択 Trigger Select	: Line		信号ポート コモン Signal Port Common

(4) 判定条件 Acceptable Conditions

- 試験中、5%を超える出力電圧の変動のない事
The regulation of output voltage must not exceed 5% of initial value during test
- 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事
The output voltage must be within the regulation of specification after the test.
- 発煙・発火のない事
Smoke and fire are not allowed.

(5) 試験結果 Test Result

PH1200A280-12	合格 OK
PH1200A280-24	合格 OK
PH1200A280-28	合格 OK
PH1200A280-36	合格 OK
PH1200A280-48	合格 OK

8. はんだ耐熱性試験 Resistance to Soldering Heat Test

MODEL : PH1200A280-12

(1) 使用装置 Machine Used

自動はんだ付け装置 : TLC-350XIV (セイテック)
Automatic Dip Soldering Machine (SEITEC)

(2) 供試体台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

PH1200A280-12 : 1 台 (1 unit)

(3) 試験条件 Test Conditions

・溶融はんだ温度 Dip Soldering Temperature	: 260°C	・予備加熱温度 Pre-heating Temperature	: 120°C
・浸漬保持時間 Dip Time	: 12 秒間 12 seconds	・予備加熱時間 Pre-heating Time	: 60 秒間 60 seconds

(4) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試体を基板にのせ、自動はんだ付装置でフラックス浸漬、予備加熱、はんだ付を行う。常温常湿下に1時間放置し、出力に異常がない事を確認する。

Check if there is no abnormal output before test. Then fix the D.U.T. on a circuit board, transfer to flux-dipping, preheat and solder in the automatic dip soldering machine. Leave it for 1 hour at the room temperature, then check if there is no abnormal output.

(5) 試験結果 Test Results

合格 OK

・試験条件 Test Conditions	PH1200A280-12		
入力電圧 : 280VDC Input Voltage	出力電流 : 100A(100%) Output Current	ベースプレート温度 : 25°C Baseplate Temperature	

測定確認項目 Check Item		試験前 Before Test	試験後 After Test
出力電圧 Output Voltage	V	12.036	12.034
効率 Efficiency	%	93.78	93.76
リップル電圧 Ripple Voltage	mVp-p	51	56
入力変動 Line Regulation	mV	0.470	0.354
負荷変動 Load Regulation	mV	0.141	0.030
絶縁抵抗 Isolation Resistance	—	異常なし OK	異常なし OK
耐電圧 Withstand Voltage	—	異常なし OK	異常なし OK
外観 Appearance	—	異常なし OK	異常なし OK

9. 热衝撃試験 Thermal Shock Test

MODEL : PH1200A280-12, PH1200A280-48

(1) 使用計測器 Equipment Used

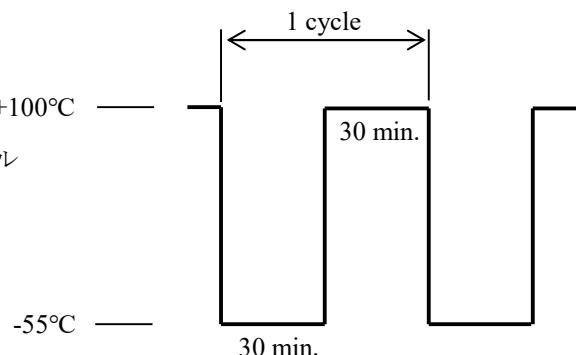
THERMAL SHOCK CHAMBER TSA-101S-W (ESPEC CORP.)

(2) 供試体台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

PH1200A280-12 : 5 台 (5 units)
PH1200A280-48 : 5 台 (5 units)

(3) 試験条件 Test Conditions

- ・電源周囲温度 : -55°C ⇄ +100°C
Ambient Temperature
- ・試験時間 : 30min. ⇄ 30 min.
Test Time
- ・試験サイクル : 125、250、375、450サイクル
Test Cycles 125, 250, 375, 450 cycles
- ・非動作
Not Operating



(4) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試体を試験槽に入れ、上記サイクルで試験を行う。125、250、375、450 サイクル後に、供試体を常温常湿下に1時間放置し、出力に異常がない事を確認する。

Before the test check if there is no abnormal output and put the D.U.T. in the testing chamber. Then test it in the above cycles. 125, 250, 375, 450 cycles later, leave it for 1 hour at room temperature and check if there is no abnormal output.

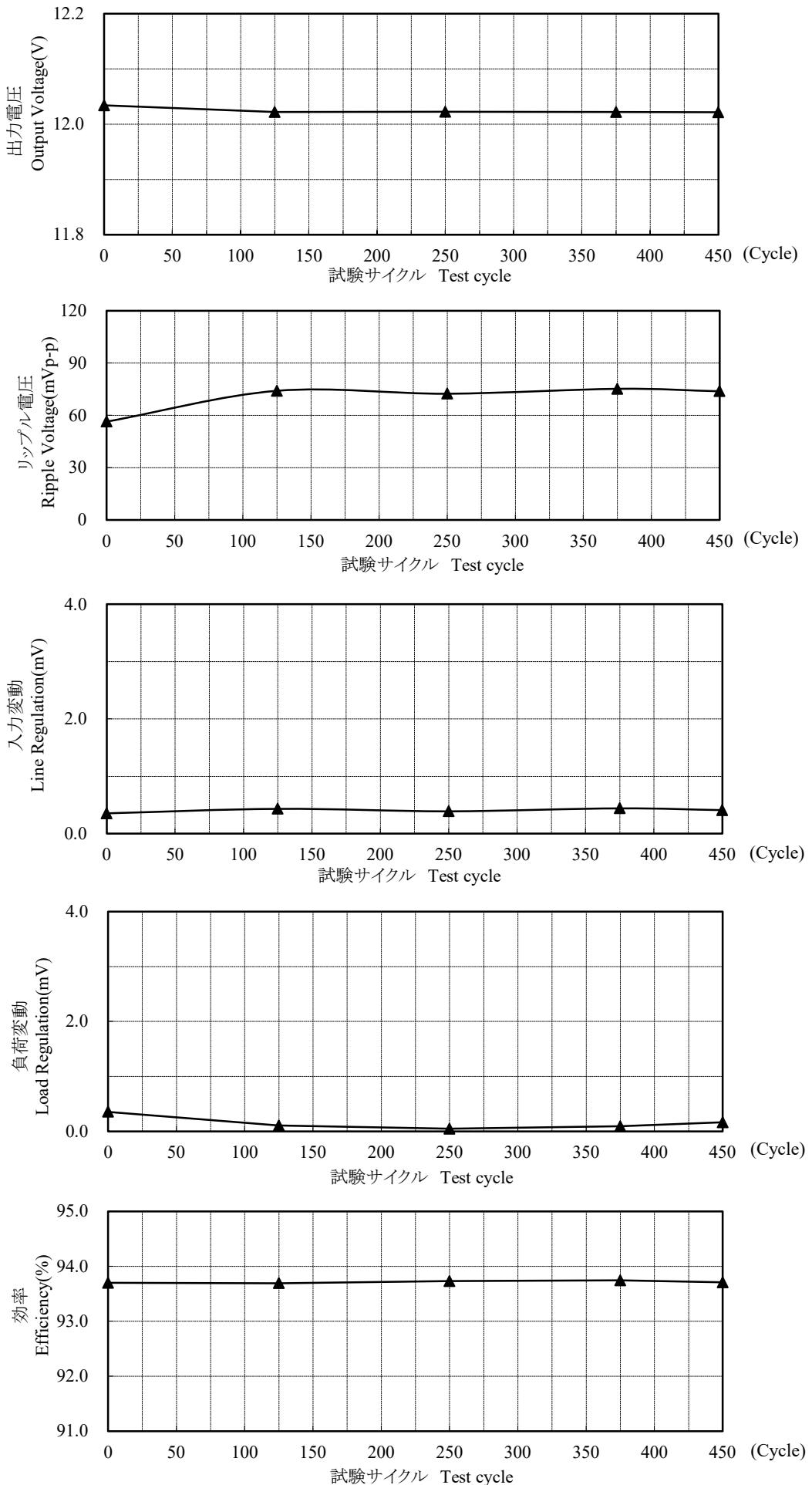
(5) 試験結果 Test Results

合格 OK

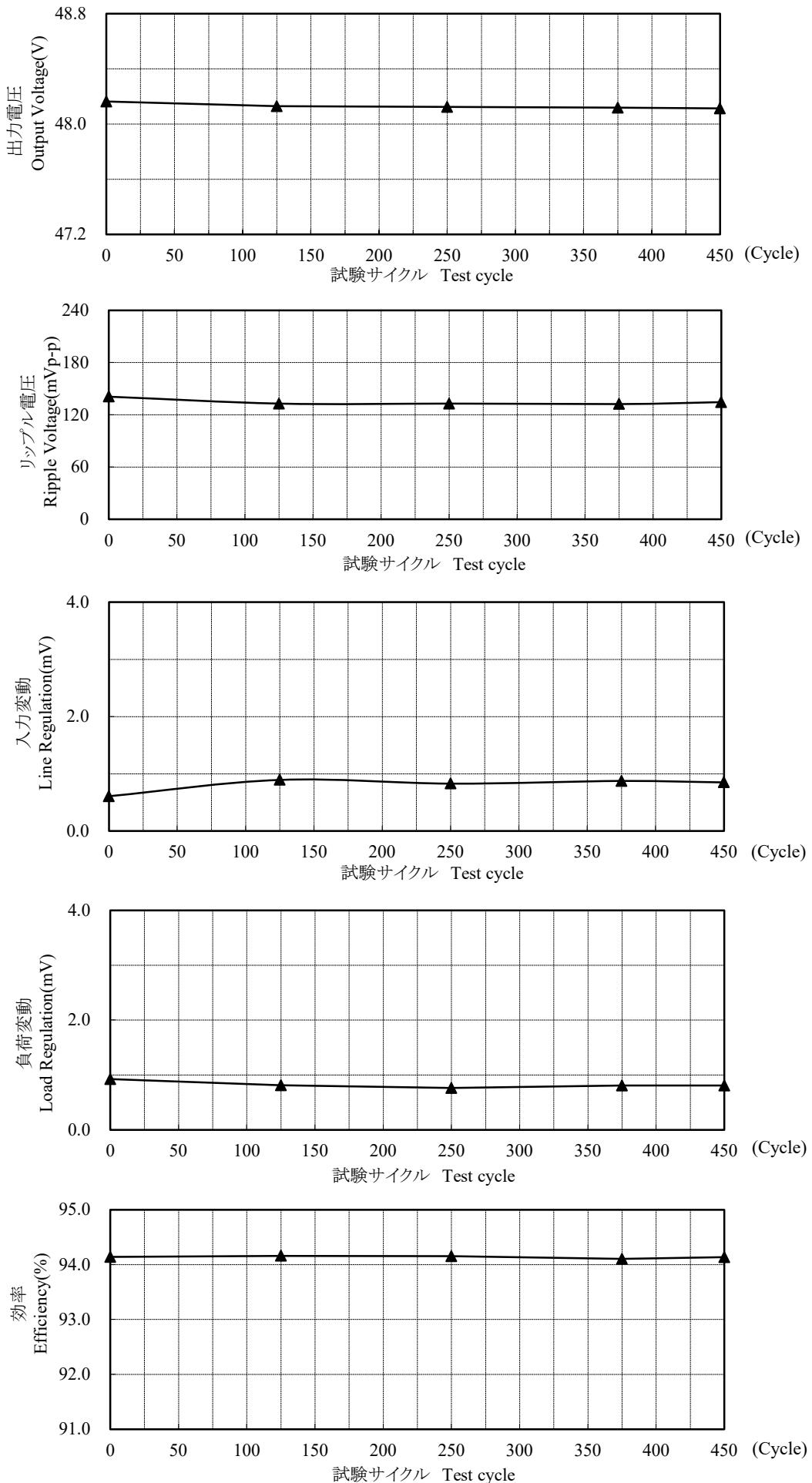
測定データは、次頁に示す。

See next page for measuring data.

(5)-1 PH1200A280-12



(5)-2 PH1200A280-48



10. 高温加湿通電試験 High Temperature and High Humidity Bias Test

MODEL : PH1200A280-12, PH1200A280-48

(1) 使用計測器 Equipment Used

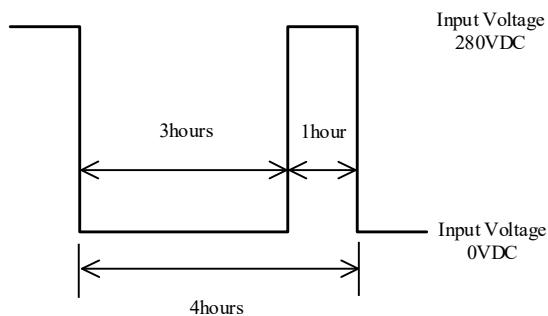
TEMP.& HUMID. CHAMBER PSL-2KPH (ESPEC CORP.)

(2) 供試体台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

PH1200A280-12 : 3 台 (3 units)
PH1200A280-48 : 3 台 (3 units)

(3) 試験条件 Test Conditions

- ・周囲温度 : 85°C
Ambient Temperature
- ・湿度 : 95%RH
Humidity
- ・試験時間 : 500時間
Test Time 500hours
- ・入力電圧 : 0VDC ⇄ 280VDC
Input Voltage
- ・出力電圧 : 定格
Output Voltage Rated
- ・出力電流 : 0A (0%)
Output Current



(4) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試体を試験槽に入れ、槽の温度を室温(25°C)からベースプレート温度が規定の温度(85°C)になるまで徐々に上げる。供試体を規定の条件にて500時間動作させ、常温常湿下に1時間放置した後、出力に異常がない事を確認する。

Check if there is no abnormal output before test. Then fix the D.U.T. in testing chamber, and the baseplate temperature is gradually increased from 25°C to 85°C. Operate the D.U.T. for 500 hours according to above conditions and leave D.U.T for 1 hour at the room temperature, then check if there is no abnormal output.

(5) 試験結果 Test Results

(5)-1 PH1200A280-12

合格 OK

・試験条件 Test Conditions

入力電圧 : 280VDC
Input Voltage出力電流 : 100A(100%)
Output Currentベースプレート温度 : 25°C
Baseplate Temperature

測定確認項目 Check Item		No.1		No.2		No.3	
		試験前 Before Test	試験後 After Test	試験前 Before Test	試験後 After Test	試験前 Before Test	試験後 After Test
出力電圧 Output Voltage	V	12.031	12.027	12.040	12.037	12.039	12.042
リップル電圧 Ripple Voltage	mVp-p	55	74	60	78	59	80
入力変動 Line Regulation	mV	0.361	0.508	0.494	0.302	0.296	0.341
負荷変動 Load Regulation	mV	0.192	0.102	0.133	0.127	0.131	0.166
絶縁抵抗 Isolation Resistance	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK
耐電圧 Withstand Voltage	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK
外観 Appearance	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK

(5)-2 PH1200A280-48

合格 OK

・試験条件 Test Conditions

入力電圧 : 280VDC
Input Voltage出力電流 : 25A(100%)
Output Currentベースプレート温度 : 25°C
Baseplate Temperature

測定確認項目 Check Item		No.1		No.2		No.3	
		試験前 Before Test	試験後 After Test	試験前 Before Test	試験後 After Test	試験前 Before Test	試験後 After Test
出力電圧 Output Voltage	V	48.154	48.178	48.173	48.132	48.164	48.151
リップル電圧 Ripple Voltage	mVp-p	144.000	142.000	140.000	140.000	137.000	142.000
入力変動 Line Regulation	mV	0.769	0.807	0.650	0.520	0.630	0.664
負荷変動 Load Regulation	mV	0.669	0.708	0.549	0.581	0.827	0.710
絶縁抵抗 Isolation Resistance	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK
耐電圧 Withstand Voltage	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK
外観 Appearance	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK

11. 高温連続通電試験 High Temperature Bias Test

MODEL : PH1200A280-12, PH1200A280-48

(1) 使用計測器 Equipment Used

TEMP. CHAMBER PSL-2KPH (ESPEC CORP.)

(2) 供試体台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

PH1200A280-12	: 3 台 (3 units)
PH1200A280-48	: 3 台 (3 units)

(3) 試験条件 Test Conditions

・ベースプレート温度 Baseplate Temperature	: 100°C	・周囲温度 Ambient Temperature	: 85°C	・試験時間 Test Time	: 500 時間 500 hours
・入力電圧 Input Voltage	: 280VDC	・出力電圧 Output Voltage	: 定格 Rated	・出力電流 Output Current	: 100%

(4) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試体を試験槽に入れ、槽の温度を室温(25°C)からベースプレート温度が規定の温度(100°C)になるまで徐々に上げる。供試体を規定の条件にて500時間動作させ、常温常湿下に1時間放置した後、出力に異常がない事を確認する。

Check if there is no abnormal output before test. Then fix the D.U.T. in testing chamber, and the baseplate temperature is gradually increased from 25°C to 100°C. Operate the D.U.T. for 500 hours according to above conditions and leave D.U.T for 1 hour at the room temperature, then check if there is no abnormal output.

(5) 試験結果 Test Results

(5)-1 PH1200A280-12

合格 OK

・試験条件 Test Conditions

入力電圧 : 280VDC

Input Voltage

出力電流 : 100A(100%)

Output Current

ベースプレート温度 : 25°C

Baseplate Temperature

測定確認項目 Check Item		No.1		No.2		No.3	
		試験前 Before Test	試験後 After Test	試験前 Before Test	試験後 After Test	試験前 Before Test	試験後 After Test
出力電圧 Output Voltage	V	12.018	12.015	11.998	11.995	11.993	11.996
リップル電圧 Ripple Voltage	mVp-p	60	53	36	54	54	53
入力変動 Line Regulation	mV	0.609	0.325	0.400	0.269	0.029	0.289
負荷変動 Load Regulation	mV	0.051	0.006	0.107	0.028	0.254	0.036
絶縁抵抗 Isolation Resistance	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK
耐電圧 Withstand Voltage	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK
外観 Appearance	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK

(5)-2 PH1200A280-48

合格 OK

・試験条件 Test Conditions

入力電圧 : 280VDC

Input Voltage

出力電流 : 25A(100%)

Output Current

ベースプレート温度 : 25°C

Baseplate Temperature

測定確認項目 Check Item		No.1		No.2		No.3	
		試験前 Before Test	試験後 After Test	試験前 Before Test	試験後 After Test	試験前 Before Test	試験後 After Test
出力電圧 Output Voltage	V	48.059	48.040	47.983	47.982	48.025	48.022
リップル電圧 Ripple Voltage	mVp-p	134	135	136	138	140	145
入力変動 Line Regulation	mV	0.086	0.003	0.307	0.041	3.513	0.325
負荷変動 Load Regulation	mV	0.257	0.462	1.345	0.455	2.486	0.677
絶縁抵抗 Isolation Resistance	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK
耐電圧 Withstand Voltage	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK
外観 Appearance	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK